

信頼性資料

発行日 2015年3月13日
資料番号 IRC-RT9H321C-B

作成:イサハヤ電子(株)品質保証統括

1. 信頼性試験結果

グループ	試験項目	試験条件	試料数	故障数	備考
1	はんだ付け性	はんだ温度 230°C 浸漬時間 5秒 ロジン系フラックス使用	45	0	
2	はんだ耐熱性	はんだ温度 260°C 浸漬時間 10秒 全体浸漬	22	0	
3	温度サイクル	Ta=Tstg(min)~Tstg(max) 各30分/サイクル 100サイクル	45	0	
4	耐 湿 性	Ta=85°C、85%R.H. 1000時間	45	0	
5	高温高湿バイアス	Ta=85°C、85%R.H. VKA=2.5V、IK=40mA 1000時間	45	0	
6	高温バイアス	Ta=85°C VKA=2.5V、IK=40mA 1000時間	45	0	
7	高 温 保 存	Ta=Tstg(max) 1000時間	45	0	
8	低 温 保 存	Ta=Tstg(min) 1000時間	45	0	
9	P C T	121°C 100%R.H. 2気圧 96時間	45	0	
10	静電破壊耐量	C=200pF、0Ω 基準端子=GNDピン 印加電圧±150V 各ピン1回印加	11	0	
		C=100pF、1.5KΩ 基準端子=GNDピン 印加電圧±1000V 各ピン1回印加	11	0	

2. 故障判定基準

グループ	故障判定基準
1	はんだ付着面積が浸漬部の95%未満のもの
2~10	電気的特性を満足しないもの 初期値に対する変化率±20%を超えるもの 外観に著しい変化が認められるもの

測定条件:製品仕様書の測定条件に準ずる

上記内容につき詳細ご確認が必要な際は
弊社営業部門までお問い合わせ願います。